

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic active components and devices – Reliability standards –  
Part 3: Laser modules used for telecommunication**

**Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de fiabilité –  
Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications**



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2014 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

#### IEC Catalogue - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

#### IEC publications search - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 14 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

#### IEC Glossary - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

More than 55 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

#### IEC Customer Service Centre - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).

### A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

#### Catalogue IEC - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

#### Recherche de publications IEC - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 14 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

#### Glossaire IEC - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

Plus de 55 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

#### Service Clients - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic active components and devices – Reliability standards –  
Part 3: Laser modules used for telecommunication**

**Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de fiabilité –  
Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

R

ICS 31.260, 33.180

ISBN 978-2-8322-1635-4

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FOREWORD.....                                                                                                 | 3  |
| INTRODUCTION.....                                                                                             | 5  |
| 1 Scope.....                                                                                                  | 6  |
| 2 Normative references .....                                                                                  | 6  |
| 3 Terms, definitions, symbols and abbreviations.....                                                          | 7  |
| 3.1 Terms and definitions.....                                                                                | 7  |
| 3.2 Symbols and abbreviations .....                                                                           | 8  |
| 4 Laser reliability and quality assurance procedure .....                                                     | 8  |
| 4.1 Demonstration of product quality.....                                                                     | 8  |
| 4.2 Testing responsibilities .....                                                                            | 9  |
| 4.2.1 General .....                                                                                           | 9  |
| 4.2.2 Recommendation applicable to laser customer/system supplier .....                                       | 9  |
| 4.2.3 Recommendation applicable to system operator .....                                                      | 9  |
| 4.3 Quality improvement programmes (QIPs).....                                                                | 9  |
| 5 Tests.....                                                                                                  | 9  |
| 5.1 General.....                                                                                              | 9  |
| 5.2 Structural similarity .....                                                                               | 10 |
| 5.3 Burn-in and screening (when applicable in the specification).....                                         | 10 |
| 6 Activities.....                                                                                             | 13 |
| 6.1 Analysis of reliability results.....                                                                      | 13 |
| 6.2 Technical visits to LMMs .....                                                                            | 14 |
| 6.3 Design/process changes .....                                                                              | 14 |
| 6.4 Deliveries.....                                                                                           | 14 |
| 6.5 Supplier documentation .....                                                                              | 14 |
| Annex A (informative) Guidance on testing in Table 1 and Table 2.....                                         | 15 |
| A.1 Laser module life tests containing thermoelectric coolers (for example, Peltier, test 1.1, Table 1) ..... | 15 |
| A.2 Laser module life tests – Uncooled modules (test 1.2, Table 1).....                                       | 15 |
| A.3 Laser diode life tests on submounts (test 1.3, Table 1) .....                                             | 16 |
| A.4 Monitor photodiode life tests (test 1.4, Table 1) .....                                                   | 16 |
| A.5 Temperature cycling and thermal shock (test 3, Table 1 and Test 2, Table 2) .....                         | 17 |
| A.6 Sealing/hermeticity (test 4, Table 1 and test 3, Table 2).....                                            | 17 |
| A.7 Shock and vibration (test 5, Table 1 and test 4, Table 2).....                                            | 17 |
| A.8 High-temperature storage (test 6, Table 1 and test 5, Table 2).....                                       | 17 |
| A.9 Electrostatic discharge sensitivity (ESD) (test 7, Table 1 and test 6, Table 2) .....                     | 18 |
| A.10 Residual gas analysis (RGA) (test 8, Table 1 and test 7, Table 2).....                                   | 18 |
| Table 1 – Initial qualification ( <i>1 of 3</i> ) .....                                                       | 10 |
| Table 2 – Maintenance of qualification ( <i>1 of 2</i> ).....                                                 | 12 |
| Table 3 – Performance for laser module reliability parameters .....                                           | 14 |
| Table A.1 – Recommended life test conditions for laser modules containing Peltier coolers.....                | 15 |
| Table A.2 – Recommended life test conditions for uncooled laser modules .....                                 | 16 |
| Table A.3 – Recommended laser diode life test conditions.....                                                 | 16 |
| Table A.4 – Recommended photodiode life test conditions.....                                                  | 17 |

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES –  
RELIABILITY STANDARDS –****Part 3: Laser modules used for telecommunication**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62572-3 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2011. This second edition constitutes a technical revision in which multiple errors in references have been corrected.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS          | Report on voting |
|---------------|------------------|
| 86C/1234/FDIS | 86C/1259/RVD     |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62572 series, published under the general title *Fibre optic active components and devices – Reliability standards*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

The laser modules covered by this International Standard are purchased by system suppliers (SS) to be inserted in equipment, which in turn are supplied/sold to a system operator (SO) or a network operator (see definitions in Clause 3).

For the system operator to act as an informed buyer, he/she should have knowledge of the potential risks posed by the use of critical components..

Optoelectronic component technology is continuing to develop. Consequently, during product development phases, many failure mechanisms in laser modules have been identified. These failure mechanisms, if undetected, could result in very short laser lifetime in system use.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62572-3:2014

Withd2W

# **FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES – RELIABILITY STANDARDS –**

## **Part 3: Laser modules used for telecommunication**

### **1 Scope**

This part of IEC 62572 deals with reliability assessment of laser modules used for telecommunication.

The aim of this standard is

- to establish a standard method of assessing the reliability of laser modules in order to minimize risks and to promote product development and reliability;
- to establish means by which the distribution of failures with time can be determined. This should enable the determination of equipment failure rates for specified end of life criteria.

In addition, guidance is given in IEC TR 62572-2.

### **2 Normative references**

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-1, *Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold*

IEC 60068-2-14, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60747-1, *Semiconductor devices – Part 1: General*

IEC 60749-6, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 6: Storage at high temperature*

IEC 60749-8, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 8: Sealing*

IEC 60749-10, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 10: Mechanical shock*

IEC 60749-11, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 11: Rapid change of temperature – Two-fluid-bath method*

IEC 60749-12, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 12: Vibration, variable frequency*

IEC 60749-25, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 25: Temperature cycling*

IEC 60749-26, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing – Human body model (HBM)*

IEC TR 62572-2, *Fibre optic active components and devices – Reliability standards – Part 2: Laser module degradation*

MIL-STD-883, *Test method standard – Microcircuits*

### 3 Terms, definitions, symbols and abbreviations

#### 3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document the following definitions apply.

##### 3.1.1

##### **laser module**

packaged assembly containing a laser diode with/without photodiode

Note 1 to entry: The module may also include a cooler and temperature sensor to enable laser temperature to be controlled and monitored. The optical output is normally via an optical fibre pigtail.

##### 3.1.2

##### **submount**

substrate upon which a laser diode or photodiode may be mounted for assembly into the laser module

Note 1 to entry: Components on submounts are also subject to qualification testing.

##### 3.1.3

##### **laser module manufacturer**

LMM

manufacturer of laser modules who provides devices meeting the requirements of the relevant detail specification (DS) and the customer's reliability requirements

##### 3.1.4

##### **network operator**

NO

organization which operates a telecommunications network

##### 3.1.5

##### **system supplier**

SS

manufacturer of telecommunications/data transmission equipment containing optoelectronic semiconductor lasers, i.e. laser module customer

##### 3.1.6

##### **system operator**

SO

network operator of telecommunications/data transmission equipment containing optoelectronic semiconductor lasers in the transmission path

Note 1 to entry: The system may also be part of other more extensive systems, for example telecommunications, rail, road vehicles, aerospace or weapons.

##### 3.1.7

##### **capability qualifying components**

CQC

components selected to represent critical stages of the process and limiting or boundary characteristics of mechanical and electro-optic design

Note 1 to entry: Such components should aid the identification of end product failure mechanisms to enable the determination of activation energies.

### 3.2 Symbols and abbreviations

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| $T_A$                 | minimum storage temperature          |
| $T_B$                 | maximum storage temperature          |
| $T_C$                 | module case temperature              |
| $T_S$                 | submount temperature                 |
| $T_{S \text{ nom}}$   | recommended submount temperature     |
| $T_{op \text{ min}}$  | module minimum operating temperature |
| $T_{op \text{ max}}$  | module maximum operating temperature |
| $T_{stg \text{ min}}$ | module minimum storage temperature   |
| $T_{stg \text{ max}}$ | module maximum storage temperature   |
| Qc                    | test for gross leak detection        |
| Qk                    | test for fine leak detection         |
| $p$                   | periodicity (in months)              |
| $n$                   | sample size                          |
| CA                    | capability approval                  |
| CQC                   | capability qualifying components     |
| DS                    | detail specification                 |
| LMM                   | laser module manufacturer            |
| ML                    | median life                          |
| NO                    | network operator                     |
| QA                    | quality approval                     |
| QIP                   | quality improvement programmes       |
| RGA                   | residual gas analysis                |
| SO                    | system operator                      |
| SS                    | system suppliers                     |

## 4 Laser reliability and quality assurance procedure

### 4.1 Demonstration of product quality

This standard (where required by the specification) gives the minimum mandatory requirements and is part of a total laser reliability and quality assurance procedure adopted by the laser module manufacturer.

It also provides guidance on the activities of system suppliers and system operators and provides feedback on field performance to laser module manufacturers and system suppliers.

The laser module manufacturer shall be capable of demonstrating, by means of qualification approval of devices, technology approval or capability approval of the manufacturing process.

- a documented and audited manufacturing process including the qualification of purchased components in accordance with an internationally recognized quality management system;
- a performance qualification programme, including for example, accelerated life testing, burn-in and screening of components and modules;
- a qualification maintenance programme to ensure continuity of reliability performance;
- a procedure to provide feedback on reliability issues to development and production.

## 4.2 Testing responsibilities

### 4.2.1 General

The testing detailed in Tables 1 and 2 is to be performed by the laser module manufacturer and component suppliers (where applicable). Additional testing may be specified in the specification.

### 4.2.2 Recommendation applicable to laser customer/system supplier

The system supplier is recommended to have a programme to analyse and verify the results including failure analysis. This programme includes an independent life test of fully packaged laser modules (see Table 2, test 1 and/or test 2 and 3 and/or test 5 (sample size >10 per test)).

### 4.2.3 Recommendation applicable to system operator

The system operator is recommended to have a programme to monitor and report field failure rates in sufficient detail to enable the system supplier and laser module manufacturer to initiate any necessary corrective actions at an early stage in the lifetime of a product.

Suppliers may have different approaches (i.e. to reliability concepts) during the development of product maturity and resource limitations may dictate testing strategies.

Alternative tests and activities to those specified are permitted, provided the LMM/SS/SO can show intent to remove end-product failures and the associated failure mechanisms. However, this will require significant data to substantiate compliance.

## 4.3 Quality improvement programmes (QIPs)

Quality improvement programmes (QIPs) shall be initiated with component suppliers and customers (SOs, SSs and LMMs) to address non-compliances (including quality and reliability problems identified during subsequent service life of the laser). The correction of non-compliances and subsequent QIPs are a required strategy to minimize reliability risks. The operation of QIPs should be stated in the quality approval (QA) generic and capability approval documents.

## 5 Tests

### 5.1 General

The tests described in Tables 1 and 2 are designed to accelerate the main failure mechanisms known to be reliability hazards in laser modules (see IEC TR 62572-2). Where appropriate, the CQC shall demonstrate an ability to reduce end product failure mechanisms. Final product validation is required to demonstrate that CQCs are operating at the boundaries of the process or technology. These tests will reduce the risk of unreliable components entering system use and will enable estimates to be made of the distribution of laser lifetimes and hence the laser failure rates.

The sample size and level of testing may vary depending on the business volume between the laser customer/system supplier (SS) and laser module manufacturer (LMM). This information will be given in the capability approval (CA) document and the specification where appropriate.

It is essential that the lasers evaluated are entirely representative of standard production devices and have passed all the production and/or specified (where applicable in the specification) burn-in and screening procedures.

**Table 1 – Initial qualification**

These tests will normally be performed by the laser manufacturer as part of an initial qualification programme.

**Table 2 – Maintenance of qualification**

These tests cover periodic monitoring performed on production devices to ensure that the quality and reliability performance established during initial qualification is maintained or improved.

## 5.2 Structural similarity

Where a range of laser modules is produced by a laser manufacturer, there may be some significant structural similarity between different type codes. A combination of results from different test programmes, where appropriate, is therefore permitted.

Consideration should be given to the fact that minor differences in technology or processing can have a major impact on reliability, whilst not being apparent during quality assessment.

Evidence shall be presented which demonstrates that all results are directly relevant.

## 5.3 Burn-in and screening (when applicable in the specification)

NOTE See IEC TR 62572-2.

The screening test should be designed by the laser module manufacturer specifically for his particular technology. Any approach based on similarity to that which is performed by other manufacturers is good for comparison purposes, but can be ineffective in achieving the actual screening goal. This is particularly true for fibre optic components whose technology is not yet mature and varies significantly from supplier to supplier.

Where a manufacturer can demonstrate component and process stability, screening procedures may be revised.

**Table 1 – Initial qualification (1 of 3)**

| Test no. | Test                                    | IEC references | Conditions                                                                                                                                                                                 | n                                    |
|----------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Initial endurance test                  |                |                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 1.1      | a) Module with thermoelectric cooler    |                | $\Phi_e$ specified, constant power<br>Temperature: $T_c = T_{op\ max}$<br>$T_s = T_{s\ nom}$<br>Duration: 5 000 h <sup>a</sup>                                                             | 25                                   |
| 1.2      | b) Module without thermoelectric cooler |                | $\Phi_e$ specified, constant power<br>Temperature: $T_c = T_{op\ max}$<br>Duration: 5 000 h <sup>a</sup>                                                                                   | 25                                   |
| 1.3      | Laser diode (submount)                  |                | Temperature: at least two test temperatures:<br>$\Phi_e$ specified, constant power<br>$T_{s1} = T_{s\ max}$<br>$T_{s2} = <T_{s1} - 10\ ^\circ\text{C}$ if applicable<br>Duration: >5 000 h | See <sup>d</sup><br>See <sup>d</sup> |

Table 1 (2 of 3)

| Test no. | Test                                                  | IEC references         | Conditions                                                                                                                                                              | n                                    |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.4      | Photodiode (in representative package)                |                        | Temperature: at least two test temperatures:<br>$V_r$ or $I_r$ specified<br>$T_{s1} = 125\text{ °C min}^b$<br>$T_{s2} = <(T_{s1} - 30\text{ °C})$<br>Duration: >1 000 h | See <sup>d</sup><br>See <sup>d</sup> |
| 1.5      | High temperature storage of the thermoelectric cooler |                        | $T = T_{\text{stg max}}$ of the cooler<br>Duration: 1 000 h                                                                                                             | 25                                   |
| 1.6      | Power cycle tests cooled devices                      |                        | Number of cycles: 20 K<br>$T_c = T_{\text{op max}}$<br>$T_s = T_c$ to $(T_c - \Delta T_{\text{max}})$                                                                   | 25                                   |
| 1.7      | High-temperature storage of the thermal sensor        |                        | $T = T_{\text{stg max}}$ of the sensor                                                                                                                                  | 25                                   |
| 2        | Fibre test                                            |                        |                                                                                                                                                                         |                                      |
| 2.1      | Fibre proof test                                      |                        | Proof test see <sup>d</sup><br>Duration see <sup>d</sup><br>Min. bend radius see <sup>d</sup>                                                                           | 10                                   |
| 2.2      | Fibre retention                                       |                        |                                                                                                                                                                         |                                      |
| 2.2.1    | Fibre pull                                            |                        | Fibre pull see <sup>d</sup>                                                                                                                                             | 10                                   |
| 2.2.2    | Side pull                                             |                        | Side pull see <sup>d</sup>                                                                                                                                              |                                      |
| 3        | Change of temperature                                 |                        | See <sup>c</sup> and <sup>d</sup>                                                                                                                                       |                                      |
| 3.1      | Rapid change of temperature                           | 60749-11               | Temperature:<br>$T_A = T_{\text{stg min}}$<br>$T_B = T_{\text{stg max}}$<br>Number of cycles = 50                                                                       | 10                                   |
| 3.2      | Temperature cycling                                   | 60749-25<br>60068-2-14 | Temperature:<br>$T_A = T_{\text{stg min}}$<br>$T_B = T_{\text{stg max}}$<br>>1 °C/min<br>Number of cycles = 500                                                         | 10                                   |
| 4        | Sealing                                               | 60749-8                | See <sup>d</sup><br>Test Qk followed by Test Qc<br>See <sup>c</sup> and <sup>d</sup> and Clause A.6                                                                     | 10                                   |
| 5        | Shock and vibration                                   |                        | See Clause A.7                                                                                                                                                          |                                      |
| 5.1      | Shock                                                 | 60749-10               | 500 G, 0,5 ms with/without thermoelectric cooler,<br>1 500 G, 0,5 ms without thermoelectric (where appropriate)<br>6-directions, 5 times each                           | 10                                   |
| 5.2      | Vibration                                             | 60749-12               | 20 – 2 000 Hz, 20 G,<br>3-directions, 30 min each                                                                                                                       | 10                                   |

**Table 1 (3 of 3)**

| Test no. | Test                                                                                                                               | IEC references           | Conditions                                                                                             | n           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6        | High temperature storage<br>(not applicable if module life test performed at equivalent case temperature and submount temperature) | 60749-6                  | Temperature: $T = T_{\text{stg max}}$<br>Duration: $>2\,000\text{ h}$<br>(See, IEC TR 62572-2)         | 10          |
| 7        | ESDS, modules<br>a) Lasers<br>b) Photodiodes                                                                                       | 60749-26                 | Human body model, see Clause A.9<br>5 discharges/test voltage, charge-discharge cycle $> 0,1\text{ s}$ | 5 per wafer |
| 8        | Residual gas analysis                                                                                                              | MIL-STD-883, Method 1018 | See <sup>d</sup><br>See Clause A.10                                                                    | 6           |
| 9        | Low-temperature storage                                                                                                            | 60068-2-1                | $T = T_{\text{stg min}}$<br>Duration: $>1\,000\text{ h}$                                               | 10          |

<sup>a</sup> Provided data about the distribution of wear-out lifetime is accumulated with sufficient accuracy. Provisional approval for product shipment shall be granted at 2 000 h. It is also recommended to continue the test until accurate extrapolation of lifetime is possible with an upper limit of 10 000 h. Durations up to 5 000 h may be needed for accurate lifetime prediction.

<sup>b</sup> Or as limited by technology.

<sup>c</sup> Results from tests 1.1 and 1.2 shall be supplemented by a laser customer/SS independent test of fully packaged modules in accordance with Table 2, test 2 and/or test 3 (sample size  $\geq 10$  per test). See also 4.2.

<sup>d</sup> Number of samples and conditions shall be determined by a laser customer/SS and LMM.

**Table 2 – Maintenance of qualification (1 of 2)**

| Test no. | Test                                                                                                                 | IEC references         | Conditions                                                                                                                                                               | n                                                           | p  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1        | Ongoing reliability test<br>a) Module (cooled)<br>b) Module (uncooled)<br>c) Laser diode (submount)<br>d) Photodiode |                        | Periodic testing:<br>Test 1.1<br>Test 1.2<br>Test 1.3<br>Test 1.4                                                                                                        | See NOTES<br>10<br>10<br>25 <sup>a</sup><br>25 <sup>a</sup> | 6  |
| 2        | Temperature cycling                                                                                                  | 60749-25<br>60068-2-14 | Temperature:<br>$T_A = T_{\text{stg min}}$<br>$T_B = T_{\text{stg max}}$<br>$> 1\text{ }^{\circ}\text{C /min}$<br>Periodic testing: number of cycles = 100 (see NOTE 1 ) | 10                                                          | 6  |
| 3        | Sealing                                                                                                              | 60749-8                | See NOTE 2<br>Test Qk followed by Test Qc<br>See NOTES and Clause A.6                                                                                                    | 10                                                          | 6  |
| 4        | Shock and vibration                                                                                                  |                        | See NOTES and Clause A.7                                                                                                                                                 |                                                             |    |
| 4.1      | Shock                                                                                                                | 60749-10               | 500 G, 1 ms with thermoelectric cooler,<br>1 500 G, 0,5 ms without thermoelectric cooler,<br>6-direction, 5 times each<br>20 – 2 000 Hz, 20 G                            | 10                                                          | 12 |
| 4.2      | Vibration                                                                                                            | 60749-12               | 3-direction, 30 min each                                                                                                                                                 | 10                                                          | 12 |

**Table 2 (2 of 2)**

| Test no.                                                                                                                                                                                                                                | Test                                                                                                                            | IEC references           | Conditions                                                                                                           | <i>n</i>    | <i>p</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                       | High temperature storage (not applicable if module life test performed at equivalent case temperature and submount temperature) | 60749-6                  | Temperature:<br>$T = T_{\text{stg max}}$<br>Duration: >2 000 h<br>Periodic testing: see NOTES (See, IEC TR 62572-2)  | 10          | 12       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                       | ESDS, modules<br>a) Lasers<br>b) Photodiodes                                                                                    | 60749-26                 | Periodic testing: see Clause A.9<br>Human body model<br>5 discharges/test voltage,<br>Charge-discharge cycle > 0.1 s | 5 per wafer | 12       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                       | Residual gas analysis                                                                                                           | MIL-STD-883, Method 1018 | See NOTE 2<br>Periodic testing: see NOTES and Clause A.10                                                            | See NOTE 2  | 6        |
| <sup>a</sup> Out of different wafers.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                      |             |          |
| NOTE 1 Results of test 2 are supplemented by a laser customer/system supplier (SS) independent test of fully packaged modules in accordance with Table 2, test 2 and/or test 3 and/or test 5 (sample size ≥ 10 per test). See also 4.2. |                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                      |             |          |
| NOTE 2 Number of samples and conditions are determined by a laser customer/SS and LMM.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                      |             |          |

## 6 Activities

### 6.1 Analysis of reliability results

The laser module customer/system supplier (SS) shall have a programme to analyse and verify a laser manufacturer's reliability claims. In particular

- life test data for the complete laser module,
- life test data for initial components, for example laser diode and photodiode,
- environmental test result, i.e. inspection requirements group B, C of the detail specification;
- where appropriate, see Clause 5, the data and test results of appropriate CQCs.

The analysis of results should lead to reporting of the laser module reliability parameters for each of the laser module types. Minimum reliability parameters are presented as in Table 3.

Where data reveals more than one wear-out mechanism, median life and dispersion in each case shall be stated.

The failure criteria used to derive these reliability parameters shall be agreed between the laser customer/system suppliers (SS) and laser module manufacturer (LMM). The criteria will be stated in the detail specification, see IEC TR 62572-2

**Table 3 – Performance for laser module reliability parameters**

| Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Measured value |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Median life (ML) at 25 °C or 55 °C: see NOTE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Years          |
| Dispersion(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Wear-out failure rate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| at 5 years ( $\lambda$ ) <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FITs           |
| at 10 years ( $\lambda$ ) <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FITs           |
| at 20 years ( $\lambda$ ) <sub>20</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FITs           |
| Wear-out activation energy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eV             |
| Random failure rate<br>( $\lambda_a$ ) @ 25 °C: see NOTE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FITs           |
| Confidence limits used:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %              |
| Random failure activation energy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eV             |
| <p>NOTE 1 This table assumes a log-normal distribution of times to failure. The dispersion parameter is the standard deviation of the logarithm to the base 'e' of the times to failure. See IEC TR 62572-2.</p> <p>NOTE 2 The reference temperature used for all parameters in this table is 25 °C. An alternative reference temperature (50 °C) may be used provided activation energies are given.</p> <p>NOTE 3 Special attention should be paid to all extrapolation models used and the justification for activation energies employed in reliability predictions is to be stated.</p> <p>Guidance on these activities is given in IEC TR 62572-2.</p> |                |

## 6.2 Technical visits to LMMs

Laser module designs continue to evolve, and a LMM may introduce significant changes which impinge on reliability. Under the negotiation between customer and manufacturer, technical visits should be performed until there is sufficient evidence of a maturing technology and production stability. These technical meetings/visits shall contain an item on the agenda that concerns quality and reliability. Where a LMM holds a capability approval, the frequency of these technical visits may be reduced provided the manufacturer can demonstrate

- that the CQCs fully represent any relevant design, process updates and reliability issues,
- satisfactory self-audit of the quality system.

## 6.3 Design/process changes

The customer/system supplier (SS) shall be informed by the laser module manufacturer (LMM) of any design or process change which may affect the form, fit or function of the end product.

## 6.4 Deliveries

Laser module designs will continue to evolve and therefore each delivered lot shall be manufactured according to a stated technology and production process.

This should be verified by the supplier/ and customer before delivery.

## 6.5 Supplier documentation

The laser customer/system supplier (SS) and component manufacturer or LMM shall incorporate, wherever possible, the tests and activities described in this standard into their in-house component qualification, or where appropriate, capability approval procedures and purchasing specifications. This documentation will be used in reliability/technical presentations, tender submissions and marketing briefs to customers.

## Annex A (informative)

### Guidance on testing in Table 1 and Table 2

#### A.1 Laser module life tests containing thermoelectric coolers (for example, Peltier, test 1.1, Table 1)

With laser modules containing thermoelectric coolers it is difficult to provide a significant degree of overstress to all key components simultaneously. During “normal operation”, the laser submount temperature is usually controlled at  $T_s = 25\text{ °C}$ . However, for a life test with a case temperature of  $T_c = T_{op\ max}$ , a useful stress can be obtained for the laser diode, fibre fixing, photodiode and thermal sensor if the cooler is operated at a relatively high current to maintain a submount temperature of  $T_s = T_{s\ nom}$ . The conditions in Table A.1 are recommended.

Some additional testing of the cooler is recommended, for example  $T_c = T_{op\ max}$  and  $T_s = T_s - 10\text{ °C}$ .

**Table A.1 – Recommended life test conditions for laser modules containing Peltier coolers**

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Case temperature           | $T_{op\ max}$                                                               |
| Laser submount temperature | $T_s = T_{s\ nom}$                                                          |
| Optical power              | Fibre output set to $P_{max}$ at start of life test (using monitor circuit) |
| Laser current              | To maintain constant monitor output                                         |
| Monitor current            | Normal bias                                                                 |
| Thermal sensor current     | Normal bias                                                                 |
| Cooler current             | To maintain constant thermistor resistance (or sensor conditions)           |
| Duration                   | > 5 000 h                                                                   |

#### A.2 Laser module life tests – Uncooled modules (test 1.2, Table 1)

For modules without thermoelectric coolers (for example Peltier), life tests can be readily performed over a range of temperatures up to the recommended maximum operating temperature for the module. During initial qualification, service life tests at two or more temperatures, for example  $T_c = T_{op\ max}$  and  $T_c\ 40\text{ °C}$  to  $50\text{ °C}$ , are recommended. Here, the accuracy of lifetime estimation becomes high in proportion to the number of test levels.

An additional life test at low temperature (duration > 2 000 h at  $T_{op\ min}$ ) may be required for modules containing epoxies or organic materials.

If only a single life test is to be performed, for example during maintenance of qualification testing, the conditions in Table A.2 are recommended.

**Table A.2 – Recommended life test conditions for uncooled laser modules**

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Case temperature     | $T_{op\ max}$                                                               |
| Optical power        | Fibre output set to $P_{max}$ at start of life test (using monitor circuit) |
| Laser current        | To maintain constant monitor photocurrent                                   |
| Monitor photocurrent | Normal bias                                                                 |
| Duration             | > 5 000 h                                                                   |

**A.3 Laser diode life tests on submounts (test 1.3, Table 1)**

The laser life test shall be performed with the laser operating at constant light output, as it would be in normal operation, unless otherwise agreed with the ONS. Temperatures in the range  $T_s = 50\ ^\circ\text{C}$  to  $80\ ^\circ\text{C}$  are often used. The acceleration in the rate of degradation, relative to normal operation, is therefore relatively small. The maximum temperature at which life tests can be performed under lasing operating conditions is usually in the range  $T_s = 70\ ^\circ\text{C}$  to  $100\ ^\circ\text{C}$ . However, constant current/life tests at temperatures up to  $T_s = 150\ ^\circ\text{C}$  can be useful in studying the reliability of contact metallizations. Actual failures do not often occur in well screened laser diodes tested at temperatures  $T_s < 90\ ^\circ\text{C}$ . In order to estimate the laser life, some extrapolation is required to predict when the threshold or operating current will exceed the pre-determined failure criterion. To obtain a reasonable increase in operating current, a life test duration greater than 5 000 h is required.

If a single life test is to be performed, for example during maintenance of qualification testing, the conditions in Table A.3 are recommended.

**Table A.3 – Recommended laser diode life test conditions**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Temperature   | $T_s = 70\ ^\circ\text{C}$          |
| Optical power | Maximum specified                   |
| Bias          | To maintain constant monitor output |
| Duration      | > 5 000 h                           |

**A.4 Monitor photodiode life tests (test 1.4, Table 1)**

Photodiode life tests are best performed with the devices under reverse bias if the susceptibility to increased dark current is to be assessed. To obtain failures in a reasonable timescale, temperatures in the range  $T_s = 125\ ^\circ\text{C}$  to  $200\ ^\circ\text{C}$  are usually required. Devices with organic passivations should be tested at temperatures below the curing temperature of the passivation.

Increased bias voltage can also be used to accelerate failure, but the dependence of lifetime on voltage would then need to be determined before a prediction of operating lifetime could be made.

It is necessary for measurements of photodiode dark currents to include measurement at the normal operating temperature. Measurements made at only the life test temperature may not detect increased surface leakage, because bulk dark currents dominate at high temperatures.

Failed photodiodes with increased dark currents (as a result of the accumulation of mobile charge) will often recover quickly if stored at high temperatures without bias. It is essential, that at the end of the test duration, the reverse bias conditions shall be maintained until the temperature is below  $30\ ^\circ\text{C}$ . The post test measurements shall be completed within 3 h. The increase in dark current of photodiodes with exposed junctions (for example unpassivated

mesa devices) is very sensitive to the package atmosphere, and small traces of oxygen or water vapour can result in decreased lifetimes. Life tests should therefore be performed with the photodiodes sealed in representative hermetic packages, and not on open submounts. Tests in flowing (nominally dry) nitrogen can produce variable results. The conditions in Table A.4 are recommended.

**Table A.4 – Recommended photodiode life test conditions**

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | In the range $T_s = 125\text{ °C}$ to $200\text{ °C}$                                                   |
| Bias        | Specified maximum reverse bias voltage.<br>Bias to be maintained during cool down prior to measurements |
| Duration    | 1 000 h                                                                                                 |
| Atmosphere  | Photodiode in representative hermetic package                                                           |

### A.5 Temperature cycling and thermal shock (test 3, Table 1 and Test 2, Table 2)

It is difficult to quantify the acceleration (with respect to normal operation) obtained from a temperature cycling test. Nevertheless, it has been clearly demonstrated that temperature cycling from  $T_c = -40\text{ °C}$  to  $+70\text{ °C}$  can reveal potentially serious hazards in laser modules associated with fibre instability, thermal mismatch between piece parts (for example coolers and submounts), and with fibre breaks.

For initial qualification, number of cycles = 500 from  $T_{\text{stg min}}$  to  $T_{\text{stg max}}$  are required. For periodic testing (3 and/or 6 monthly), the number of cycles = 100. The temperature cycling procedure should follow either:

- IEC 60068-2-14, Test Na: two-chamber method;
- IEC 60068-2-14, Test Nb: single-chamber method, rate of change equal to 1, 3, or  $5\text{ °C/min}$ .

Well designed and constructed modules should be able to withstand such a test with negligible changes in module performance.

### A.6 Sealing/hermeticity (test 4, Table 1 and test 3, Table 2)

The post-test assessment for test 4, Table 1 and test 3, Table 2 shall be fine-leak testing, Test Qk, followed by the gross-leak Test Qc. Suitable precautions shall be taken to eliminate absorption of helium by the fibre coating to avoid measurement errors.

### A.7 Shock and vibration (test 5, Table 1 and test 4, Table 2)

These tests are designed to simulate conditions involving vibration and shock that a component may be subjected to in service or during transportation. For a module with thermoelectric cooler the cooler is the limiting device, so the shock test should be limited to 500 G.

### A.8 High-temperature storage (test 6, Table 1 and test 5, Table 2)

Temperature storage testing has the advantage of being relatively inexpensive because no bias circuitry is required. Provided the test is performed at or below the maximum storage temperature for the module  $T_c \leq T_{\text{stg max}}$ , it can be regarded as non-destructive. Storage at high temperatures (for example  $T_c = 70\text{ °C}$ , duration = 1 000 h) will, although the stress is relatively small, provide useful protection against major problems with fibre alignment

instability and will identify some potential metallization and solder failure mechanisms, for example thermoelectric cooler or thermistor failures.

#### **A.9 Electrostatic discharge sensitivity (ESD) (test 7, Table 1 and test 6, Table 2)**

Optoelectronic components are sensitive to damage by electrostatic discharge (ESD) at all stages during manufacture, testing, assembly into equipment and operation. Exposure to ESD can result in sudden failure, parametric shifts, or even latent damage leading to a reduced lifetime during subsequent operation. The sensitivity of the laser and monitor photodiode to ESD damage should be determined so that the appropriate level of precautions can be taken to avoid damage.

The minimum recommended testing for modules is to subject five laser diodes and five monitor photodiodes on a wafer basis, to the “human body model” test described in IEC 60749-26. However, rather than applying a single go-no-go test condition, transients of increasing voltage should be applied to determine the threshold at which failures occur.

Failure should be defined as a parametric change in

- photodiode dark current or in laser threshold current;
- slope efficiency;
- forward voltage;
- reverse leakage current or light output spectrum.

The criteria are given in IEC TR 62572-2.

#### **A.10 Residual gas analysis (RGA) (test 8, Table 1 and test 7, Table 2)**

Certain laser module reliability hazards associated with high package water content are unlikely to be detected with the testing described in Tables 1 and 2. Hermeticity testing and residual gas analysis of transmitter modules is necessary to demonstrate that the module package contains a dry, inert atmosphere throughout its operating life. High-temperature life testing alone is not likely to detect reliability hazards associated with high package water content. See also Clause A.2 and Tables 1 and 2, test 7.

**Caution:** the pre-bake temperature for RGA in MIL-STD-883, method 1018 is 120 °C. This may be greater than the storage temperature  $T_{\text{stg max}}$  of most optoelectronic components. A lower pre-bake temperature of  $T_c = T_{\text{stg max}}$  for a longer period is therefore recommended until the background level of RGA remains constant. This level can then be eliminated from the results.

---

IECNORM.COM :: Click to view the full PDF of IEC 62572-3:2014

## SOMMAIRE

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AVANT-PROPOS.....                                                                                                                             | 22 |
| INTRODUCTION.....                                                                                                                             | 24 |
| 1 Domaine d'application .....                                                                                                                 | 25 |
| 2 Références normatives .....                                                                                                                 | 25 |
| 3 Termes, définitions, symboles et abréviations.....                                                                                          | 26 |
| 3.1 Termes et définitions .....                                                                                                               | 26 |
| 3.2 Symboles and abréviations .....                                                                                                           | 27 |
| 4 Fiabilité du laser et procédure d'assurance de la qualité.....                                                                              | 27 |
| 4.1 Démonstration de la qualité du produit.....                                                                                               | 27 |
| 4.2 Responsabilité des essais.....                                                                                                            | 28 |
| 4.2.1 Généralités.....                                                                                                                        | 28 |
| 4.2.2 Recommandation applicable au client du laser/fournisseur du système .....                                                               | 28 |
| 4.2.3 Recommandation applicable à l'opérateur du système .....                                                                                | 28 |
| 4.3 Programmes d'amélioration de la qualité (QIP) .....                                                                                       | 28 |
| 5 Essais .....                                                                                                                                | 29 |
| 5.1 Généralités .....                                                                                                                         | 29 |
| 5.2 Associativité .....                                                                                                                       | 29 |
| 5.3 Vieillesse artificielle et déverminage (s'ils sont applicables dans la spécification) .....                                               | 29 |
| 6 Activités .....                                                                                                                             | 33 |
| 6.1 Analyse des résultats de fiabilité.....                                                                                                   | 33 |
| 6.2 Visites techniques aux LMM.....                                                                                                           | 34 |
| 6.3 Changements au niveau de la conception/du processus .....                                                                                 | 34 |
| 6.4 Livraisons.....                                                                                                                           | 34 |
| 6.5 Documentation fournisseur.....                                                                                                            | 34 |
| Annexe A (informative) Lignes directrices concernant les essais dans les Tableaux 1 et 2.....                                                 | 35 |
| A.1 Essais d'endurance sur modules laser comprenant des refroidisseurs thermoélectriques (par exemple, Peltier, essai 1.1 du Tableau 1) ..... | 35 |
| A.2 Essais d'endurance sur modules laser – Modules non refroidis (essai 1.2, Tableau 1).....                                                  | 35 |
| A.3 Essais d'endurance de diodes laser sur supports (essai 1.3, Tableau 1).....                                                               | 36 |
| A.4 Essais d'endurance sur photodiode de contrôle (essai 1.4, Tableau 1) .....                                                                | 36 |
| A.5 Cycles de température et choc thermique (essai 3, Tableau 1 et Essai 2, Tableau 2) .....                                                  | 37 |
| A.6 Étanchéité/herméticité (essai 4, Tableau 1 et essai 3, Tableau 2) .....                                                                   | 37 |
| A.7 Chocs et vibrations (essai 5, Tableau 1 et essai 4, Tableau 2).....                                                                       | 38 |
| A.8 Stockage à température élevée (essai 6, Tableau 1 et essai 5, Tableau 2) .....                                                            | 38 |
| A.9 Sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) (essai 7, Tableau 1 et essai 6, Tableau 2) .....                                         | 38 |
| A.10 Analyse des gaz résiduels (RGA) (essai 8, Tableau 1 et essai 7, Tableau 2) .....                                                         | 38 |
| Tableau 1 – Qualification initiale (1 de 2) .....                                                                                             | 30 |
| Tableau 2 – Maintien de la qualification .....                                                                                                | 32 |
| Tableau 3 – Performances des paramètres de fiabilité des modules laser.....                                                                   | 33 |

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau A.1 – Conditions d'essai d'endurance recommandées pour les modules laser dotés de refroidisseurs Peltier ..... | 35 |
| Tableau A.2 – Conditions d'essai d'endurance recommandées pour les modules laser non refroidis.....                    | 36 |
| Tableau A.3 – Conditions recommandées pour l'essai d'endurance sur diode laser .....                                   | 36 |
| Tableau A.4 – Conditions recommandées d'essai d'endurance sur photodiodes .....                                        | 37 |

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62572-3:2014

Withd2W

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS EN FIBRES OPTIQUES – NORMES DE FIABILITÉ –

#### Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications

##### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62572-3 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2011. Cette édition constitue une révision technique, dans laquelle de multiples erreurs de références ont été corrigées.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS          | Rapport de vote |
|---------------|-----------------|
| 86C/1234/FDIS | 86C/1259/RVD    |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62472, publiées sous le titre général *Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de fiabilité*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTRODUCTION

Les modules laser couverts par la présente Norme internationale sont approvisionnés par des fournisseurs de systèmes (SS) pour être insérés dans un matériel, lui-même fourni/vendu à un opérateur du système (SO) ou à un exploitant de réseau (voir les définitions à l'Article 3).

Pour que l'opérateur du système se comporte en acheteur averti, une connaissance des risques potentiels posés par l'utilisation de composants critiques est nécessaire.

Les techniques relatives aux composants optoélectroniques sont en constante évolution. Par conséquent, au cours des phases de développement des produits, de nombreux mécanismes de défaillance ont été identifiés au sein des modules laser. Ces mécanismes de défaillance, s'ils ne sont pas détectés, pourraient occasionner des durées de vie du laser très courtes au niveau de l'utilisation du système.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62572-3:2014

## COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS EN FIBRES OPTIQUES – NORMES DE FIABILITÉ –

### Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62572 traite de l'évaluation de la fiabilité des modules laser utilisés pour les télécommunications.

La présente norme a pour objet

- d'établir une méthode normalisée permettant d'évaluer la fiabilité des modules laser afin de minimiser les risques et de favoriser le développement et la fiabilité des produits;
- d'établir des moyens permettant de déterminer la répartition des défaillances au fil du temps. Il convient que ceci permette de déterminer les taux de défaillance du matériel pour les critères de fin de vie spécifiés.

En outre, des lignes directrices sont données dans l'IEC TR 62572-2.

#### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-2-1, *Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essai A: Froid*

IEC 60068-2-14, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60747-1, *Dispositifs à semiconducteurs – Partie 1: Généralités*

IEC 60749-6, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 6: Stockage à haute température*

IEC 60749-8, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 8: Étanchéité*

IEC 60749-10, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 10: Chocs mécaniques*

IEC 60749-11, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 11: Variations rapides de température – Méthode des deux bains*

IEC 60749-12, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 12: Vibrations, fréquences variables*

IEC 60749-25, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 25: Cycles de température*

IEC 60749-26, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) – Modèle du corps humain (HBM)*

IEC TR 62572-2, *Fibre optic active components and devices – Reliability standards – Part 2: Laser module degradation* (disponible en anglais seulement)

MIL-STD-883, *Test method standard – Microcircuits*

### 3 Termes, définitions, symboles et abréviations

#### 3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent

##### 3.1.1

##### **module laser**

composant intégré constitué d'une diode laser avec/sans photodiode

Note 1 à l'article: Il est permis que le module inclue aussi un refroidisseur et un capteur de température permettant de contrôler et de surveiller la température du laser. La sortie optique se fait normalement par une fibre amorce optique.

##### 3.1.2

##### **support**

substrat sur lequel peut être montée une diode laser ou une photodiode en vue d'être assemblée dans un module laser

Note 1 à l'article: Les composants sur ces supports sont également soumis à un essai de qualification.

##### 3.1.3

##### **fabricant de modules laser**

LMM

fabricant de modules laser fournissant des dispositifs répondant aux exigences de la spécification particulière (DS) applicable et aux exigences de fiabilité du client

##### 3.1.4

##### **exploitant de réseau**

NO

organisme qui exploite un réseau de télécommunication

##### 3.1.5

##### **fournisseur de système**

SS

fabricant de matériel de télécommunications/transmission de données comprenant des lasers à semiconducteurs optoélectroniques, c'est-à-dire client de modules laser

##### 3.1.6

##### **opérateur de système**

SO

exploitant de réseau utilisant du matériel de télécommunications/transmission de données comprenant des lasers à semiconducteurs optoélectroniques au niveau des voies de transmission

Note 1 à l'article: Il est également permis que le système s'intègre dans d'autres systèmes plus étendus, par exemple les télécommunications, les transports ferroviaires, les véhicules routiers, l'aérospatiale ou l'armement.

**3.1.7****composants pour agrément de savoir-faire****CQC**

composants sélectionnés pour supporter les étapes critiques du processus et les caractéristiques restrictives propres à une conception mécanique et électro-optique

Note 1 à l'article: Il convient que ces composants servent à identifier les mécanismes de défaillance du produit final permettant de déterminer les énergies d'activation.

**3.2 Symboles and abréviations**

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| $T_A$                 | température minimale de stockage                 |
| $T_B$                 | température maximale de stockage                 |
| $T_C$                 | température du boîtier du module                 |
| $T_S$                 | température du support                           |
| $T_{S \text{ nom}}$   | température du support recommandée               |
| $T_{op \text{ min}}$  | température minimale du module en fonctionnement |
| $T_{op \text{ max}}$  | température maximale du module en fonctionnement |
| $T_{op \text{ min}}$  | température minimale de stockage du module       |
| $T_{stg \text{ max}}$ | température maximale de stockage du module       |
| Qc                    | essai de détection de fuite importante           |
| Qk                    | essai de détection de fuite fine                 |
| $p$                   | périodicité (en mois)                            |
| $n$                   | nombre d'échantillons                            |

| <b>Terme</b> | <b>Terme en français</b>                 | <b>Equivalent en anglais</b>     |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| CA           | agrément de savoir-faire                 | capability approval              |
| CQC          | composants pour agrément de savoir-faire | capability qualifying components |
| DS           | spécification particulière               | detail specification             |
| LMM          | fabricant de modules laser               | laser module manufacturer        |
| ML           | mi-vie                                   | median life                      |
| NO           | exploitant de réseau                     | network operator                 |
| QA           | agrément de la qualité                   | quality approval                 |
| QIP          | programmes d'amélioration de la qualité  | quality improvement programmes   |
| RGA          | analyse des gaz résiduels                | residual gas analysis            |
| SO           | opérateur de système                     | system operator                  |
| SS           | fournisseur de système                   | system suppliers                 |

**4 Fiabilité du laser et procédure d'assurance de la qualité****4.1 Démonstration de la qualité du produit**

La présente norme (si exigé par la spécification) donne les exigences obligatoires minimales et s'intègre dans une procédure de fiabilité totale du laser et d'assurance de la qualité adoptée par le fabricant du module laser.

Elle fournit également des lignes directrices concernant les activités des fournisseurs de systèmes et des opérateurs de systèmes, et donne un retour d'expérience concernant les performances sur le terrain aux fabricants de modules laser et aux fournisseurs de systèmes.

Moyennant une homologation de dispositifs, un agrément de technologie ou un agrément de savoir-faire du processus de fabrication, le fabricant de modules laser doit être capable de présenter

- a) un processus de fabrication documenté et audité comprenant la qualification de composants approvisionnés conformément à un système de gestion de la qualité reconnu au niveau international
- b) un programme de qualification de performance comprenant, par exemple, les essais d'endurance accélérée, le vieillissement artificiel et le déverminage de composants et de modules;
- c) un programme de maintien de la qualification permettant d'assurer la continuité de la performance de fiabilité;
- d) une procédure permettant de fournir un retour sur les problèmes de fiabilité au niveau du développement et de la production.

## **4.2 Responsabilité des essais**

### **4.2.1 Généralités**

Les essais détaillés dans les Tableaux 1 et 2 doivent être réalisés par le fabricant de modules laser et par les fournisseurs de composants (le cas échéant). Des essais supplémentaires sont susceptibles d'être spécifiés dans la spécification.

### **4.2.2 Recommandation applicable au client du laser/fournisseur du système**

Il est recommandé que le fournisseur du système ait un programme permettant l'analyse et la vérification des résultats d'essais, y compris l'analyse des défaillances. Ce programme comprend un essai d'endurance indépendant réalisé sur des modules laser prêts à être utilisés (voir Tableau 2, essai 1 et/ou essais 2 et 3 et/ou essai 5 (nombre d'échantillons >10 par essai)).

### **4.2.3 Recommandation applicable à l'opérateur du système**

Il est recommandé que l'opérateur du système ait un programme permettant de contrôler et de signaler les taux de défaillance sur le terrain avec suffisamment de détails pour permettre au fournisseur du système ainsi qu'au fabricant de modules laser de lancer toute action corrective nécessaire à un stade précoce de la durée de vie d'un produit.

Il est admis que les fournisseurs aient des approches différentes (au niveau des concepts de fiabilité) au cours du développement de la maturité du produit, et que des limitations de ressources dictent les stratégies d'essai.

Il est permis de pratiquer des essais et des activités différents de ceux spécifiés, à condition que les LMM/SS/SO puissent démontrer leur intention de supprimer les défaillances du produit final et les mécanismes de défaillance associés. Cependant, des données significatives seront nécessaires pour justifier la conformité.

## **4.3 Programmes d'amélioration de la qualité (QIP)**

Des programmes d'amélioration de la qualité (QIP) doivent être lancés par les fournisseurs et les clients des composants (SO, SS et LMM) afin de faire face aux non-conformités (y compris les problèmes de qualité et de fiabilité identifiés lors de la durée d'utilisation ultérieure du laser). La correction des non-conformités et les QIP résultants constituent une stratégie nécessaire pour minimiser les risques concernant la fiabilité. Il convient d'indiquer le déroulement des QIP dans les documents génériques d'agrément de la qualité (QA) et les documents d'agrément de savoir-faire.

## 5 Essais

### 5.1 Généralités

Les essais décrits dans les Tableaux 1 et 2 sont conçus pour accélérer les principaux mécanismes de défaillance connus pour représenter des risques au niveau de la fiabilité des modules laser (voir IEC TR 62572-2). Le cas échéant, le CQC doit démontrer une aptitude à réduire les mécanismes de défaillance du produit final. La validation du produit final est nécessaire pour prouver que les CQC fonctionnent dans les limites du processus ou de la technologie. Ces essais réduiront le risque que représentent des composants non fiables pénétrant dans le système et permettront de faire des estimations au niveau de la répartition des durées de vie du laser et par conséquent des taux de défaillance du laser.

Le nombre d'échantillons et le niveau d'essai sont susceptibles de varier en fonction du volume d'échanges entre le client du laser ou le fournisseur du système (SS), et le fabricant du module laser (LMM). Ces informations seront indiquées dans le document d'agrément de savoir-faire (CA) et la spécification, le cas échéant.

Il est primordial que les lasers évalués soient entièrement représentatifs des dispositifs de production normalisés, et qu'ils aient subi toutes les procédures de production et/ou de vieillissement artificiel et de déverminage spécifiées (si applicables dans la spécification).

#### *Tableau 1 – Qualification initiale*

Ces essais seront normalement réalisés par le fabricant du laser comme partie intégrante d'un programme de qualification initial.

#### *Tableau 2 – Maintien de la qualification*

Ces essais couvrent la surveillance périodique exercée sur les dispositifs de production, afin d'assurer le maintien ou l'amélioration de la qualité et des performances de fiabilité établies au cours de la qualification initiale.

### 5.2 Associativité

Quand une gamme de modules laser est produite par un fabricant de lasers, une associativité significative est admise entre différents codes types. Une combinaison de résultats de différents programmes d'essai, le cas échéant, est par conséquent autorisée.

Il convient de prendre en compte le fait que des différences mineures au niveau des techniques ou du traitement peuvent avoir un impact majeur sur la fiabilité, alors que ce fait n'est pas apparent au cours de l'évaluation de la qualité.

Des preuves doivent être présentées, démontrant que tous les résultats sont directement applicables.

### 5.3 Vieillissement artificiel et déverminage (s'ils sont applicables dans la spécification)

NOTE Voir IEC TR 62572-2.

Il convient que l'essai de déverminage soit conçu par le fabricant de modules laser spécifiquement pour sa technologie particulière. Toute approche fondée sur une similarité avec les réalisations d'autres fabricants permet d'établir des comparaisons, mais elle peut être inefficace pour atteindre l'objectif de déverminage réel. C'est le cas particulièrement pour les composants pour fibres optiques dont les technologies ne sont pas encore stabilisées et varient de façon significative d'un fournisseur à l'autre.

Quand un fabricant peut démontrer une stabilité des composants et des processus, une révision des procédures de déverminage est permise.

**Tableau 1 – Qualification initiale (1 de 2)**

| Essai n° | Essai                                                          | Références IEC | Conditions                                                                                                                                                                                       | n                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | Essai d'endurance initial                                      |                |                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 1.1      | a) Module avec refroidisseur thermoélectrique                  |                | $\Phi_e$ spécifié, puissance constante<br>Température: $T_c = T_{op\ max}$<br>$T_s = T_{s\ nom}$<br>Durée: 5 000 h <sup>a</sup>                                                                  | 25                                     |
| 1.2      | b) Module sans refroidisseur thermoélectrique                  |                | $\Phi_e$ spécifié, puissance constante<br>Température: $T_c = T_{op\ max}$<br>Durée: 5 000 h <sup>a</sup>                                                                                        | 25                                     |
| 1.3      | Diode laser (support)                                          |                | Température: au moins deux températures d'essai:<br>$\Phi_e$ spécifié, puissance constante<br>$T_{s1} = T_{s\ max}$<br>$T_{s2} = < T_{s1} - 10\ ^\circ\text{C}$ si applicable<br>Durée: >5 000 h | Voir <sup>d</sup><br>Voir <sup>d</sup> |
| 1.4      | Photodiode (d'une série représentative)                        |                | Température: au moins deux températures d'essai:<br>$I_r$ ou $I_r$ spécifié<br>$T_{s1} = 125\ ^\circ\text{C min}^b$<br>$T_{s2} = < (T_{s1} - 30\ ^\circ\text{C})$<br>Durée: >1 000 h             | Voir <sup>d</sup><br>Voir <sup>d</sup> |
| 1.5      | Température élevée, stockage du refroidisseur thermoélectrique |                | $T = T_{stg\ max}$ du refroidisseur<br>Durée: 1 000 h                                                                                                                                            | 25                                     |
| 1.6      | Essais de cycle de puissance, dispositifs refroidis            |                | Nombre de cycles: 20 K<br>$T_c = T_{op\ max}$<br>$T_s = T_c$ à $(T_c - \Delta T_{max})$                                                                                                          | 25                                     |
| 1.7      | Température élevée, stockage du capteur thermique              |                | $T = T_{stg\ max}$ du capteur                                                                                                                                                                    | 25                                     |
| 2        | Essai de la fibre                                              |                |                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 2.1      | Essai de résistance de la fibre                                |                | Essai de résistance voir <sup>d</sup><br>Durée voir <sup>d</sup><br>Rayon de courbure min. voir <sup>d</sup>                                                                                     | 10                                     |
| 2.2      | Retenue de la fibre                                            |                |                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 2.2.1    | Traction de la fibre                                           |                | Traction de la fibre voir <sup>d</sup>                                                                                                                                                           | 10                                     |
| 2.2.2    | Traction latérale                                              |                | Traction latérale voir <sup>d</sup>                                                                                                                                                              |                                        |
| 3        | Variations de température                                      |                | Voir <sup>c</sup> et <sup>d</sup>                                                                                                                                                                |                                        |
| 3.1      | Variations rapides de température                              | 60749-11       | Température:<br>$T_A = T_{stg\ min}$<br>$T_B = T_{stg\ max}$<br>Nombre de cycles = 50                                                                                                            | 10                                     |

Tableau 1 (2 de 2)

| Essai n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Essai                                                                                                                                                | Références IEC            | Conditions                                                                                                                                                 | n               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cycles de température                                                                                                                                | 60749-25<br>60068-2-14    | Température:<br>$T_A = T_{\text{stg min}}$<br>$T_B = T_{\text{stg max}}$<br>>1 °C/min<br>Nombre de cycles = 500                                            | 10              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Étanchéité                                                                                                                                           | 60749-8                   | Voir <sup>d</sup><br>Essai Qk suivi de l'essai Qc<br>Voir <sup>c</sup> et <sup>d</sup> et l'Article A.6                                                    | 10              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chocs et vibrations                                                                                                                                  |                           | Voir l'Article A.7                                                                                                                                         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chocs                                                                                                                                                | 60749-10                  | 500 G, 0,5 ms avec/sans refroidisseur thermoélectrique, 1 500 G, 0,5 ms sans refroidisseur thermoélectrique (si approprié)<br>6 directions, 5 fois chacune | 10              |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vibrations                                                                                                                                           | 60749-12                  | 20 – 2 000 Hz, 20 G,<br>3 directions, 30 min chacune                                                                                                       | 10              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stockage à haute température (non applicable si essai d'endurance du module réalisé à température de boîtier et température de support équivalentes) | 60749-6                   | Température: $T = T_{\text{stg max}}$<br>Durée: > 2 000 h<br>(Voir IEC TR 62572-2)                                                                         | 10              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DES, modules<br>a) Lasers<br>b) Photodiodes                                                                                                          | 60749-26                  | Modèle du corps humain, voir l'Article A.9<br>5 décharges/tension d'essai, cycle de charge-décharge > 0,1 s                                                | 5 par plaquette |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Analyse des gaz résiduels                                                                                                                            | MIL-STD-883, Méthode 1018 | Voir <sup>d</sup><br>Voir l'Article A.10                                                                                                                   | 6               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stockage à basse température                                                                                                                         | 60068-2-1                 | $T = T_{\text{stg min}}$<br>Durée: >1 000 h                                                                                                                | 10              |
| <p><sup>a</sup> A condition que les données relatives à la répartition de la période de défaillance par usure soient réunies avec une précision suffisante. Un agrément provisoire pour l'expédition du produit doit être accordé après 2 000 h. Il est aussi recommandé de poursuivre l'essai jusqu'à ce qu'une extrapolation précise de la durée de vie soit possible avec une limite supérieure de 10 000 h. Des durées atteignant 5 000 h sont susceptibles d'être nécessaires pour prévoir avec précision la durée de vie.</p> <p><sup>b</sup> Ou selon les limites techniques.</p> <p><sup>c</sup> Les résultats des essais 1.1 et 1.2 doivent être complétés par un essai réalisé indépendamment par le client du laser/SS sur les modules prêts à l'utilisation, conformément au Tableau 2, essai 2 et/ou essai 3 (nombre d'échantillons ≥ 10 par essai). Voir également 4.2.</p> <p><sup>d</sup> Le nombre d'échantillons et les conditions doivent être déterminés par le client du laser/SS et le LMM.</p> |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                            |                 |

**Tableau 2 – Maintien de la qualification**

| Essai n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Essai                                                                                                                                                | Références IEC            | Conditions                                                                                                                                                    | n                                                            | p  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Essai de fiabilité continue<br>a) Module (refroidi)<br>b) Module (non refroidi)<br>c) Diode laser (support)<br>d) Photodiode                         |                           | Essai périodique:<br><br>Essai 1.1<br>Essai 1.2<br>Essai 1.3<br>Essai 1.4                                                                                     | Voir NOTES<br>10<br>10<br>25 <sup>a</sup><br>25 <sup>a</sup> | 6  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cycles de température                                                                                                                                | 60749-25<br>60068-2-14    | Température:<br>$T_A = T_{stg \text{ min}}$<br>$T_B = T_{stg \text{ max}}$<br>> 1 °C/min<br><br>Essai périodique: Nombre de cycles = 100 (voir NOTE 1)        | 10                                                           | 6  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Étanchéité                                                                                                                                           | 60749-8                   | Voir NOTE 2<br><br>Essai Qk suivi de l'essai Qc<br>Voir NOTES et l'Article A.6                                                                                | 10                                                           | 6  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chocs et vibrations                                                                                                                                  |                           | Voir NOTES et l'Article A.7                                                                                                                                   |                                                              |    |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chocs                                                                                                                                                | 60749-10                  | 500 G, 1 ms avec refroidisseur thermoélectrique<br>1 500 G, 0,5 ms sans refroidisseur thermoélectrique<br>6 directions, 5 fois chacune<br>20 – 2 000 Hz, 20 G | 10                                                           | 12 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vibrations                                                                                                                                           | 60749-12                  | 3 directions, 30 min chacune                                                                                                                                  | 10                                                           | 12 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stockage à haute température (non applicable si essai d'endurance du module réalisé à température de boîtier et température de support équivalentes) | 60749-6                   | Température:<br>$T = T_{stg \text{ max}}$<br><br>Durée: >2 000 h<br><br>Essai périodique: voir NOTES (Voir l'IEC TR 62572-2)                                  | 10                                                           | 12 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DES, modules<br>a) Lasers<br>b) Photodiodes                                                                                                          | 60749-26                  | Essai périodique:<br>voir l'Article A.9<br><br>Modèle du corps humain<br><br>5 décharges/tension d'essai<br><br>Cycle de charge-décharge<br>> 0,1 s           | 5 par plaquette                                              | 12 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analyse des gaz résiduels                                                                                                                            | MIL-STD-883, Méthode 1018 | Voir NOTE 2<br><br>Essai périodique:<br>voir NOTES et l'Article A.10                                                                                          | Voir NOTE 2                                                  | 6  |
| <sup>a</sup> Parmi différentes plaquettes.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                               |                                                              |    |
| NOTE 1 Les résultats de l'essai 2 sont complétés par un essai réalisé indépendamment par le client du laser/fournisseur du système (SS) sur les modules prêts à l'utilisation, conformément au Tableau 2, essai 2 et/ou essai 3 et/ou essai 5 (nombre d'échantillons ≥ 10 par essai). Voir également 4.2. |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                               |                                                              |    |
| NOTE 2 Le nombre d'échantillons et les conditions sont déterminés par le client du laser/SS et le LMM.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                               |                                                              |    |

## 6 Activités

### 6.1 Analyse des résultats de fiabilité

Le client du module laser/fournisseur du système (SS) doit avoir un programme permettant d'analyser et de vérifier les déclarations de fiabilité d'un fabricant de modules laser. En particulier

- les données relatives à l'essai d'endurance pour le module laser complet,
- les données relatives à l'essai d'endurance concernant les composants initiaux, par exemple les diodes laser et les photodiodes,
- le résultat des essais d'environnement, c'est-à-dire exigences de contrôle, groupe B, C de la spécification particulière;
- le cas échéant, voir Article 5, les données et les résultats d'essai des CQC correspondants.

Il convient que l'analyse des résultats donne lieu à une indication des paramètres de fiabilité des modules laser pour chaque type de module laser. Les paramètres minimaux de fiabilité sont présentés comme dans le Tableau 3.

Lorsque les données révèlent plus d'un mécanisme d'usure, la durée de vie médiane et sa dispersion doit être indiquée pour chaque cas.

Les critères de défaillance utilisés pour déduire ces paramètres de fiabilité doivent faire l'objet d'un accord entre le client du matériel laser/le fournisseur du système (SS) et le fabricant du module laser (LMM). Les critères seront indiqués dans la spécification particulière, voir IEC TR 62572-2.

**Tableau 3 – Performances des paramètres de fiabilité des modules laser**

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valeur mesurée |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A mi-vie (ML) à 25 °C ou 55 °C: voir NOTE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Années         |
| Dispersion(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Taux de défaillance par usure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| à 5 ans ( $\lambda$ ) <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FITs           |
| à 10 ans ( $\lambda$ ) <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FITs           |
| à 20 ans ( $\lambda$ ) <sub>20</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FITs           |
| Energie d'activation d'usure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eV             |
| Taux de défaillance aléatoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ( $\lambda_a$ ) à 25 °C: voir NOTE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FITs           |
| Limites de fiabilité utilisées:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %              |
| Energie d'activation de défaillance aléatoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eV             |
| <p>NOTE 1 Ce tableau présuppose une répartition log-normale des temps avant défaillance. Le paramètre de dispersion représente l'écart type du logarithme en base «e» des temps avant défaillance. Voir l'IEC TR 62572- 2.</p> <p>NOTE 2 La température de référence utilisée pour tous les paramètres de ce tableau est de 25 °C. Il est permis d'utiliser une température de référence différente (50 °C), à condition que les énergies d'activation soient indiquées.</p> <p>NOTE 3 Il convient de prêter une attention particulière à tous les modèles d'extrapolation utilisés, et la justification relative aux énergies d'activation employées dans les prédictions de fiabilité doit être mentionnée.</p> <p>Des lignes directrices concernant ces activités sont données dans l'IEC TR 62572-2.</p> |                |